

[DAS 招待講演]

グラフ構造を用いたリソグラフィホットスポット検出

新田 泉

株式会社富士通研究所

概要：

リソグラフィ工程における欠陥箇所（リソグラフィホットスポット）予測に機械学習を適用した事例を紹介します。回路パターンをグラフ構造で表現し、グラフカーネルを用いた学習により、欠陥要因となる局所的なパターンの認識精度を向上しました。また、近年、機械学習適用においては判断結果だけでなく、その根拠をユーザにわかりやすく示すことが課題となっています。提案手法では、予測対象のパターンと類似するパターンを過去データから提示することで、現場エンジニアが結果の妥当性を容易に確認できるような仕組みを提供しました。